

Skanning elektronmikroskopi SEM

Skanning elektronmikroskopi er et nyttig redskap for å observere små (mikroskopisk/nano- skala) objekter og generere bilder med høy oppløselighet ved høye forstørrelser. Ulike detektorer gir ulike bildekvaliteter og vurderes ut fra hvilke egenskaper som skal optimaliseres (Inlens, SE, BSE, CL).

I geologiske preparater er det også ofte viktig å vite noe om den kjemiske sammensetningen og fordelingen av denne. Av denne grunn er mikroskopene utstyrt med en rekke detektorer som kan gi svar på nettopp dette (EDS, EBSD, WDS).

Instituttet har tilgang til et bredt spekter av analyseteknikker, men tilbyr for øyeblikket kun et begrenset utvalg. Ta kontakt for veiledning.

<i>Mikroskop</i>	<i>Detektorer</i>	<i>Lokasjon</i>
Zeiss Sigma	Inlens, SE, BSE	KAM
Zeiss Merlin VP Compact	Inlens, SE, EDS, EBSD, WDS, CL, VP,	KAM
Hitachi TM 3030 Benchtop	BSE, EDS	IG

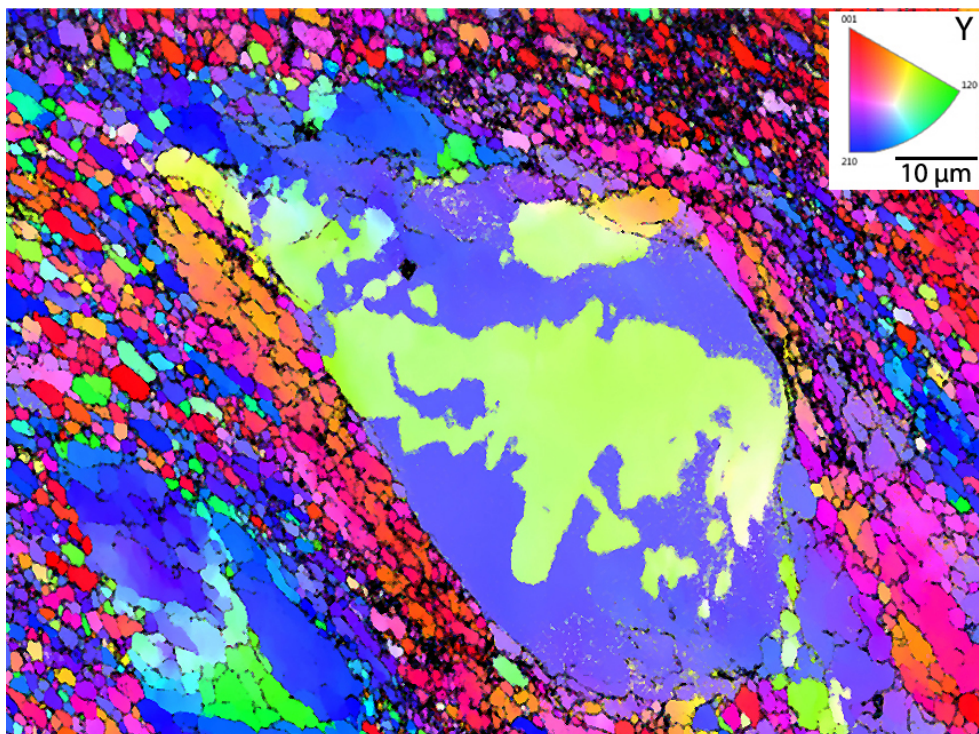
Link: [Instruments](#) | [UiT](#)



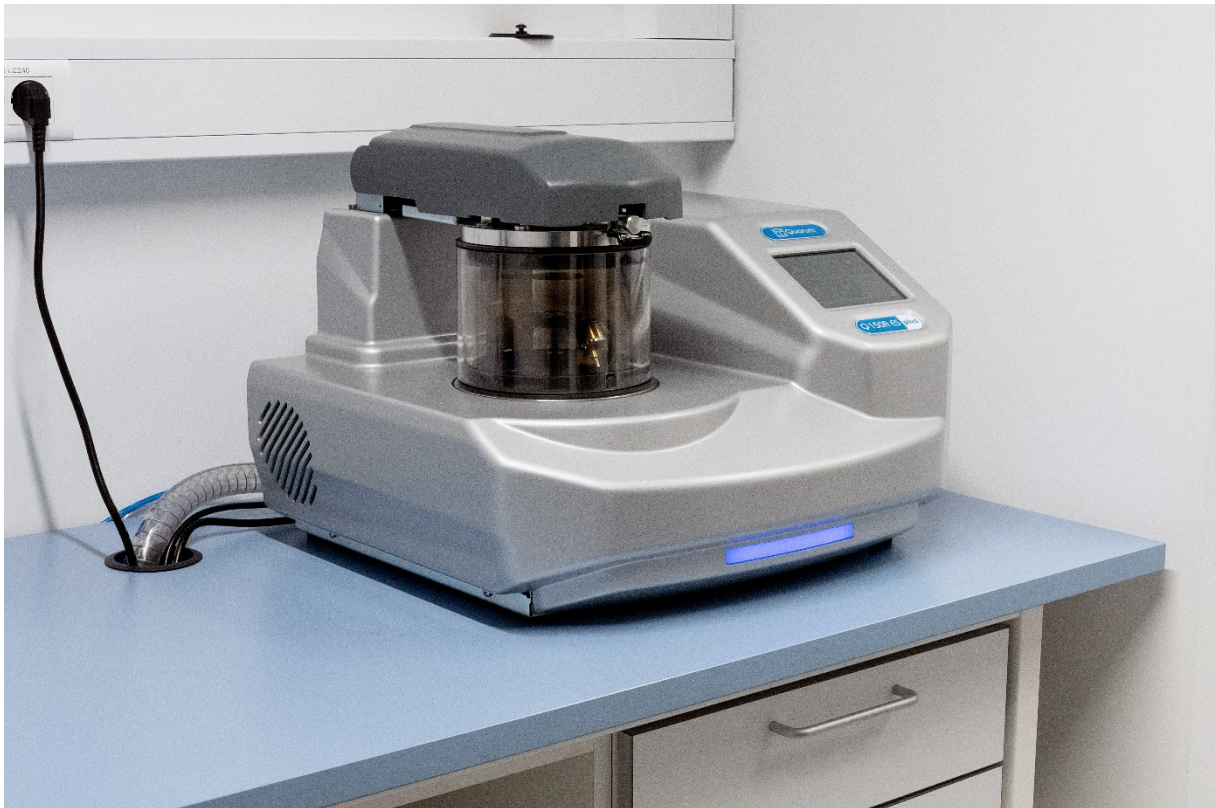
Foto: Kai Mortensen



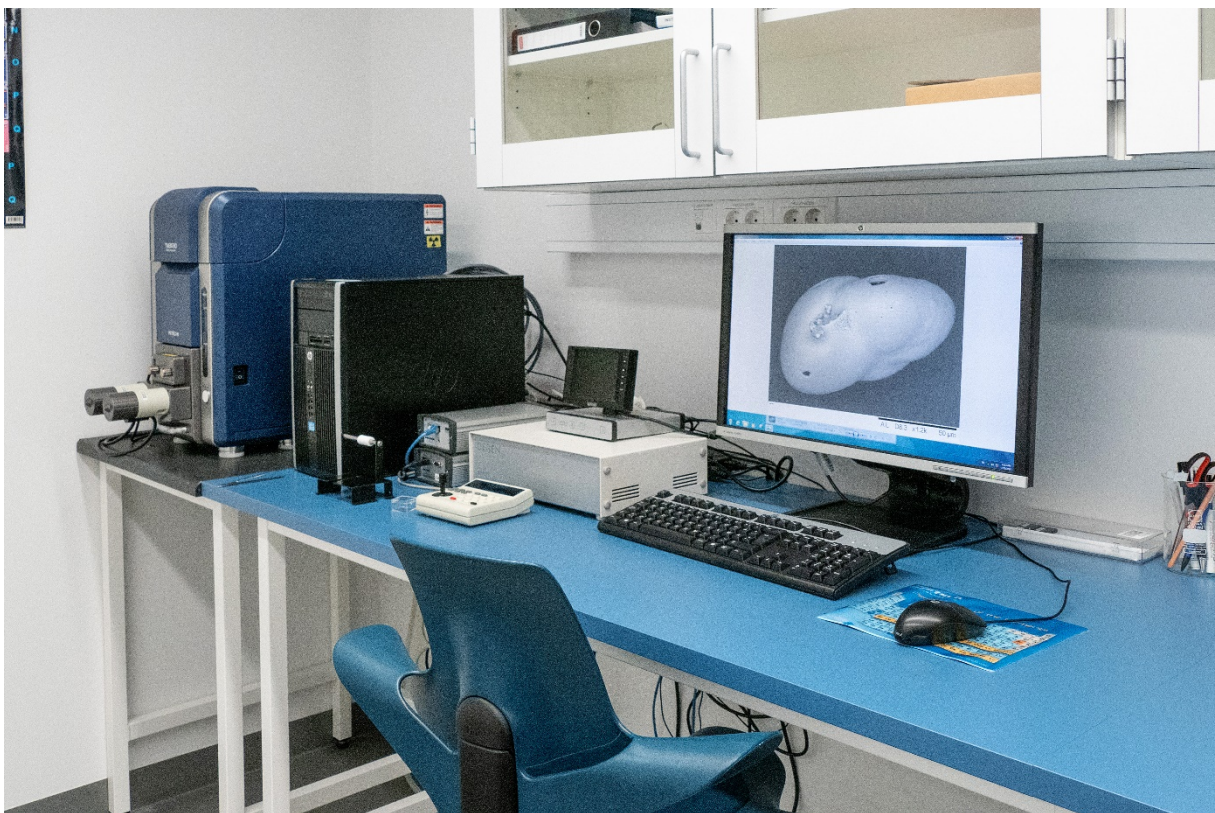
Foto: Kai Mortensen



EBSD kart



Coater (foto: Kai Mortensen)



*Hitachi bordmodellen er utstyrt med «tilt & rotation stage» samt EDS detektor.
Foto: Kai Mortensen*